



# Seminario de Estudiantes 2017-B

*Invita a la última plática del periodo Otoño 2017*

## **El Porqué de la difracción a alta resolución.**

Presenta

**Dr. Sylvain Jean Bernès Flouriot\***

Materiales Complejos e Inteligentes  
Instituto de Física Luis Rivera Terrazas (IFUAP)-BUAP

### **RESUMEN**

La difracción de Rayos X sobre materiales en el estado cristalino se considera como una técnica analítica “segura” cuando se necesita determinar las posiciones atómicas en el material bajo estudio. Sin embargo, además de sus restricciones intrínsecas cuanto a la pureza de la muestra, la aplicación de la técnica está limitada por la resolución alcanzada en el espacio recíproco. Existe el riesgo de interpretar inadecuadamente o sobre-interpretar información estructural en el espacio directo cuando el experimento introduce, por ejemplo, factores de estructura con fases incorrectas. Tener acceso a datos de alta resolución no es por lo tanto un capricho de los materialistas, sino más bien una necesidad para afinar los detalles del análisis estructural cuando el problema por resolver lo requiere. Se discutirán algunos casos resueltos recientemente en el IF-UAP, tanto en ciencia de materiales como en química sintética.

**Fecha: 28 de Noviembre de 2017**

**Lugar: Auditorio del IFUAP, Edificio IF1**

**Horario: 16 hrs.**

- \*email: [sbernes@ifuap.buap.mx](mailto:sbernes@ifuap.buap.mx)
- Contacto: [seminario\\_estudiantes@ifuap.buap.mx](mailto:seminario_estudiantes@ifuap.buap.mx)
- [www.ifuap.buap.mx/seminario/SeminarioEstudiantil.php](http://www.ifuap.buap.mx/seminario/SeminarioEstudiantil.php)